

コンパクトで低価格

膜厚測定・表面形状測定 フィルメトリクス株式会社

予算申請カタログ



2021年度版

膜厚測定システム

世界中で 5000 台以上使用されている
ベーシックモデルのアカデミック版です。

仕様

- 膜厚測定範囲 15nm ~ 70 μ m
- 測定波長領域 380 - 1050nm
- 測定 スポット径 標準 Φ 1.5mm



F20

FILMETRICS
I I I I I A K L A Company

商品ラインナップ

- F20-UV
膜厚測定範囲 : 1nm-40 μ m
- F20-EXR
膜厚測定範囲 : 15nm-250 μ m

オプション

- 透過率測定
- 測定スポット最小 Φ 0.1 mm
- 12inch 回転ステージ
- 曲面サンプル

顕微鏡式自動マッピング膜厚測定システム

フォーカス、XY の移動、ベースラインを全て
自動化、サンプルを置くだけで膜厚分布が
測定できます。

仕様

- 膜厚測定範囲 20nm ~ 40 μ m
(5倍対物レンズ)
- XY自動ステージ 200mm × 200mm
- 高速測定 25ポイント/14秒



新製品

F54-XY

FILMETRICS
I I I I I A K L A Company

商品ラインナップ

- F54-XY-200-UV
膜厚測定範囲 : 4nm-35 μ m
- F54-XY-200-EXR
膜厚測定範囲 : 20nm-120 μ m

オプション

- パターン認識

サンプル測定のご案内

※ 測定膜厚範囲は、膜材料など、サンプルの条件によって異なります。

※ サンプル測定を実施しております。御見積書・御購入の前に、測定の可否、装置仕様のご確認をお願いいたします。

フィルメトリクス株式会社

資料請求等のお問合せ先は

URL : www.filmetrics.co.jp
メール : info@filmetrics.co.jp

3次元表面形状測定システム

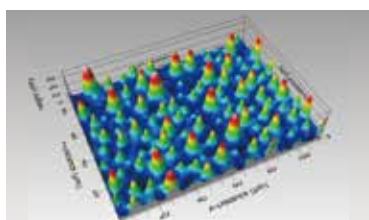
Profilm3D

表面形状・段差・粗さ測定システムを身近に！

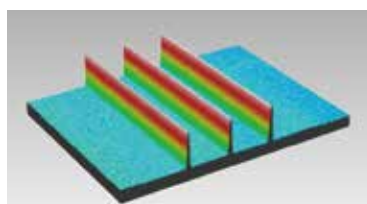
FILMETRICS
A KLA Company

1台でナノオーダーの表面粗さからミリオオーダーの形状段差測定まで可能です。

段差測定範囲	～ 10 mm
段差測定正確性	0.7%
XY分解能	最小 0.4μm
測定ステージ	100×100mm 200×200mm



ポリマー混合物の3次元形状



導波路型回折格子



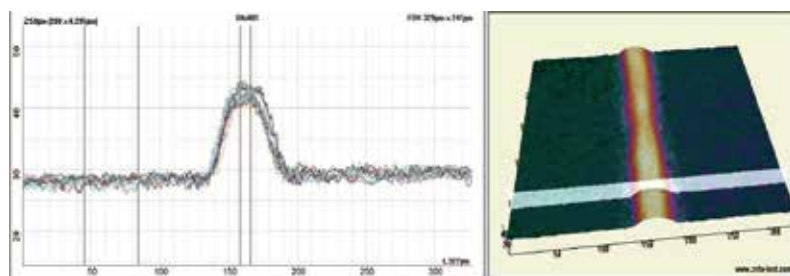
マルチ共焦点顕微鏡システム

Zeta-20

独自の ZDot™ テクノロジーで高速測定！

KLA+
INSTRUMENTS

非接触で段差・粗さ・寸法の測定結果を True Color 画像で表示します。デュアル光源を搭載し、高反射率部と低反射率部を同時に測定できます。



太陽電池サンプル

反射率が95%の銀電極部と、1%以下の黒いセル部を同時に測定



FILMETRICS
A KLA Company

フィルメトリクス株式会社

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-9 新横浜フジカビル8F Tel : 045-473-7109
Email : info@filmetrics.co.jp URL : www.filmetrics.co.jp